

**Изменение № 4 ГОСТ 20.57.406—81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.86 № 1096 срок введения установлен**

**с 01.01.87**

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначения: (СТ СЭВ 5121—85, СТ СЭВ 5244—85); заменить ссылку: СТ СЭВ 781—72 на СТ СЭВ 781—77.

Вводную часть после слов «в части методов испытаний на ВВФ» дополнить словами: «СТ СЭВ 5121—85 и СТ СЭВ 5244—85 в части методов испытаний на ВВФ изделий электронной техники».

*(Продолжение см. с. 234)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 20.57.406—81)

Пункт 2.21.4. Заменить значение: «минус  $(20 \pm 5)$  °С» на «минус  $(25 \pm 3)$  °С».

Пункт 2.25.5. Заменить значение:  $\pm 0,2$  кгс/см<sup>2</sup> на  $\pm 20$  кПа ( $\pm 0,2$  кгс/см<sup>2</sup>).

Приложение 26. Таблицу дополнить методами испытаний:

ГОСТ 20.57.406—81		Стандарты СЭВ		
Методы испытаний	Номера методов	Методы испытаний	Номера методов	Обозначение СТ СЭВ
Испытание на воздействие инея и росы Испытание на воздействие повышенного давления	206—1	Испытание на воздействие инея и росы	2100.1	СТ СЭВ 5121—85
	210—1	Испытание на воздействие повышенного давления газов	2071.1	СТ СЭВ 5244—85

(ИУС № 8 1986 г.)